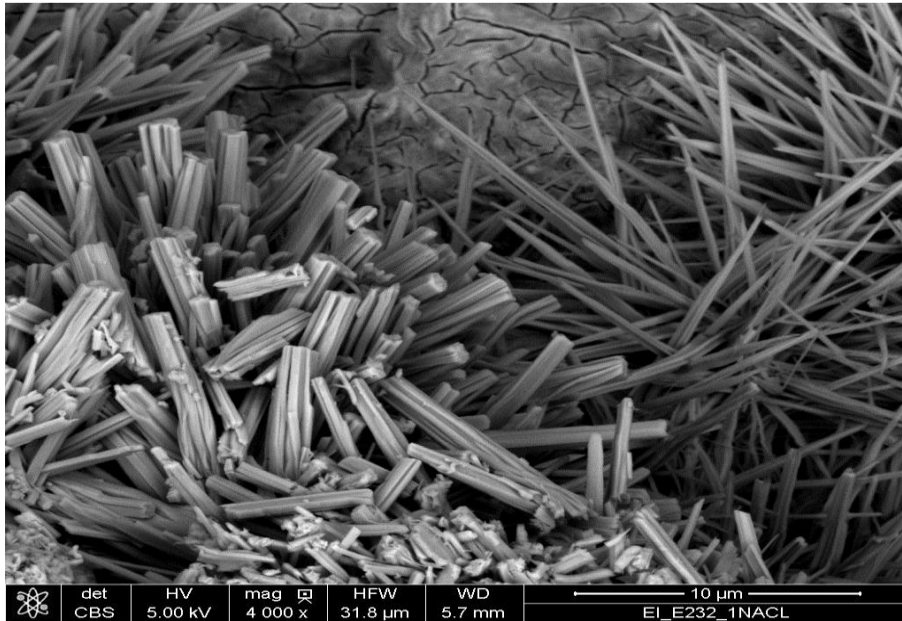


Métallographie de Thielleux Delphine



TITRE :

**CARTOGRAPHIE EBSD HAUTE RESOLUTION D'UN ACIER 316L DEFORME DE
27% A TEMPERATURE AMBIANTE**

DESCRIPTIF TECHNIQUE :

La micrographie a été réalisée avec une tension de 5kV sur un MEB FEI Nova Nanosem 450 avec un détecteur

d'électrons retrodiffusés retractable (CBS) à un grandissement de 4000.

TEXTE :

L'échantillon présenté ici a subi un essai corrosion en immersion dans une solution concentrée en NaCl. Dans ce cas, la microscopie électronique à balayage permet de distinguer les différentes populations d'oxydes de Magnésium en surface de l'échantillon en termes de taille et de morphologie.